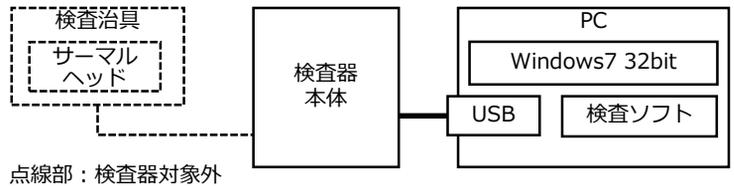
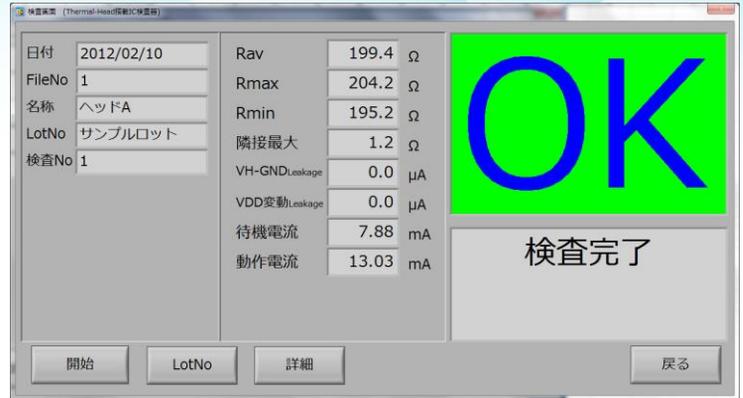


Thermal-Head搭載IC検査器



概要

サーマルプリントヘッドに搭載されたICの並びにヘッド抵抗の検査を行う検査器です。

<主な機能>

- 抵抗測定機能(電圧印加、電圧・電流測定による)
- VDD付(IC印加用)
- ロジック信号(CLK・DATA・LAT・STB)にてIC制御
- ヘッドと治具の接続を検査する機能(Pin間短絡検査機能)
- IC不良を確認する機能(Pin間短絡、抵抗値測定以外の検査項目)

仕様

検査項目	Pin間短絡検査、Diode特性検査、DO出力耐圧検査、抵抗値測定、FF/LAT保持検査、VDD変動試験・出力波形検査(VHリーク電流測定)、IC消費電流検査(静止時/動作時)
ヘッド信号	CLK1-2、DATA1-2、LAT1-2、STB1-6、各CLK/ DATA / LAT OUT1-2(選択可能)、VDD、VH、GND
抵抗測定範囲	100~300Ω(VH印加電圧：0-6V)
ロジック電圧レベル	0-10V
CLK	1MHz~24MHz
VDD印加電圧	0-6V
本体外形寸法(mm)	W149×L330×H320